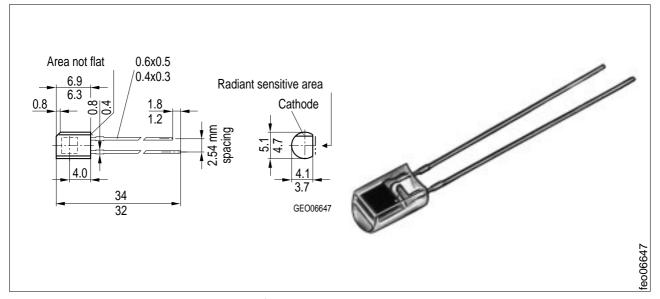
SIEMENS

Silizium-PIN-Fotodiode Silicon PIN Photodiode

SFH 206 K



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm
- Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
- 5-mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
- Auch gegurtet lieferbar

Anwendungen

- Computer-Blitzlichtgeräte
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Industrieelektronik
- "Messen/Steuern/Regeln"

Features ■ Especi

- Especially suitable for applications from 400 nm to 1100 nm
- Short switching time (typ. 20 ns)
- 5 mm LED plastic package
- Also available on tape

Applications

- Computer-controlled flashes
- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ	Bestellnummer
Type	Ordering Code
SFH 206 K	Q62702-P129



Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{ m op};T_{ m stg}$	- 40 + 100	°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \le 3$ s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ($t \le 3$ s)	$T_{\mathbb{S}}$	230	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_{R}	32	V
Verlustleistung, $T_{\rm A}$ = 25 °C Total power dissipation	P _{tot}	150	mW

Kennwerte ($T_{\rm A}$ = 25 °C, Normlicht A, T = 2856 K) Characteristics ($T_{\rm A}$ = 25 °C, standard light A, T = 2856 K)

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Fotoempfindlichkeit, $V_{\rm R}$ = 5 V Spectral sensitivity	S	80 (≥ 50)	nA/Ix
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	λ _{S max}	850	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S=10~\%$ von $S_{\rm max}$ Spectral range of sensitivity $S=10~\%$ of $S_{\rm max}$	λ	400 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	7.00	mm ²
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$ $L \times W$	2.65 × 2.65	mm×mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseober- fläche Distance chip front to case surface	Н	1.2 1.4	mm
Halbwinkel Half angle	φ	± 60	Grad deg.
Dunkelstrom, $V_{\rm R}$ = 10 V Dark current	I_{R}	2 (≤ 30)	nA

SIEMENS

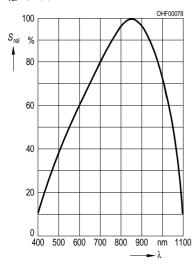
Kennwerte ($T_{\rm A}$ = 25 °C, Normlicht A, T = 2856 K) Characteristics ($T_{\rm A}$ = 25 °C, standard light A, T = 2856 K) (cont'd)

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Spektrale Fotoempfindlichkeit, λ = 850 nm Spectral sensitivity	S_{λ}	0.62	A/W
Quantenausbeute, λ = 850 nm Quantum yield	η	0.90	Electrons Photon
Leerlaufspannung, $E_{\rm v}$ = 1000 lx Open-circuit voltage	V_{O}	365 (≥ 310)	mV
Kurzschlußstrom, $E_{\rm v}$ = 1000 lx Short-circuit current	I_{SC}	80	μΑ
Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_{\rm L}$ = 50 Ω ; $V_{\rm R}$ = 5 V; λ = 850 nm; $I_{\rm p}$ = 800 μ A	$t_{\rm r},t_{\rm f}$	20	ns
Durchlaßspannung, $I_{\rm F}$ = 100 mA, E = 0 Forward voltage	V_{F}	1.3	V
Kapazität, $V_{\rm R}$ = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance	C_0	72	pF
Temperaturkoeffizient von $V_{\rm O}$ Temperature coefficient of $V_{\rm O}$	TC_{V}	- 2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von $I_{\rm SC}$ Temperature coefficient of $I_{\rm SC}$	TC_1	0.18	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_{\rm R}$ = 10 V, λ = 850 nm	NEP	4.2 × 10 ⁻¹⁴	$\frac{W}{\sqrt{Hz}}$
Nachweisgrenze, $V_{\rm R}$ = 10 V, λ = 850 nm Detection limit	D*	6.3×10^{12}	<u>cm · √Hz</u> W

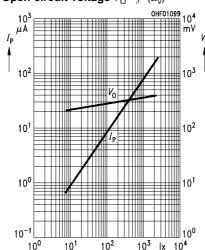
SIEMENS

Relative spectral sensitivity

 $S_{\text{rel}} = f(\lambda)$



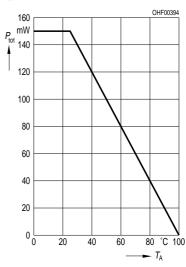
Photocurrent $I_P = f(E_V)$, $V_R = 5 \text{ V}$ Open-circuit voltage $V_O = f(E_V)$



- Ε_γ

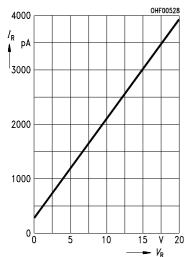
Total power dissipation

 $P_{\text{tot}} = f (T_{\text{A}})$



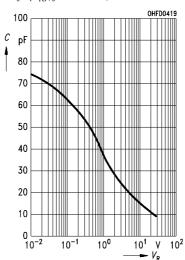
Dark current

 $I_{R} = f(V_{R}), E = 0$



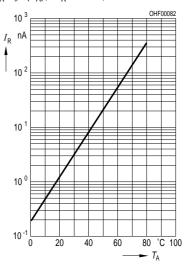
Capacitance

 $C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



Dark current

 $I_{R} = f (T_{A}), V_{R} = 10 \text{ V}, E = 0$



Directional characteristics $S_{rel} = f(\varphi)$

